

「次世代電子顕微鏡法」社会連携講座

# 第3回 電子顕微鏡セミナー ～TEM 入門コース～

基本理論の解説から装置の操作に関するやや発展的な内容まで  
電子顕微鏡初学者を対象としたセミナーです。

日 時：2025 年 **11月7日(金)** **13:00-17:00** (受付 12:30 ～)

開催形式：対面

定 員：150 名（事前登録制先着順）

会 場：武田先端知ビル 5F

参加費：無料

お申し込み：下記 URL もしくは QR コードよりお申込みください

<https://forms.gle/DqP8GvrceYxvNQXq6>



● お問い合わせ：東京大学・日本電子産学連携室 金子・斎藤 E-mail: [skaneko@jeol.co.jp](mailto:skaneko@jeol.co.jp)

## プログラム

13:00 ～ 13:05 開会挨拶、オリエンテーション

東京大学大学院工学系研究科 石川 亮

13:05 ～ 14:05 TEM の構造

日本電子株式会社 ソリューション開発センター 近藤 行人

14:05 ～ 14:45 いろいろな試料作製方法の紹介

日本電子株式会社 EM 事業 U 福永 啓一

14:45 ～ 14:55 休憩

14:55 ～ 15:35 FIB による TEM サンプルングについて

日本電子株式会社 EP 事業 U 柴田 昌照

15:35 ～ 16:15 各種イメージング手法の紹介

東京大学・日本電子産学連携室 斎藤 光浩

16:15 ～ 16:55 EDS の基礎

日本電子株式会社 EM 事業 U 三浦 颯人

16:55 ～ 17:00 閉会挨拶

主催：東京大学・次世代電子顕微鏡法社会連携講座

共催：東京大学・日本電子産学連携室、マテリアル先端リサーチインフラ事業 (ARIM)



東京大学  
次世代電子顕微鏡法  
社会連携講座



東京大学・日本電子 産学連携室

The University of Tokyo - JEOL  
University-Corporate Collaboration Office

